

機器名	X線分析装置付走査電子顕微鏡 (SEM-EDX/WDX) 【有料貸出機器】	
メーカー名・型番	日本電子 JSM-5600LV	
分類	分析・観察関連	
仕様	<p>加速電圧:0.5～30kV 像分解能:高真空モード 3.5nm以上 (2次電子像) 低真空モード 5.0nm以上 (反射電子像) 試料サイズ:最大 150mmφ程度の試料が装着でき、120mmφ程度の全面観察が可能 検出器:半導体検出器、分解能 145eV以下、検出可能元素 B～U(EDS) 分光器:4結晶横型フルスキャンタイプ、分析元素 B～U(WDS)</p>	
特徴	<p>走査電子顕微鏡は、電子線を電子レンズにより収束させて、観察試料上を走査し、表面から放出される2次電子、反射電子により高倍率観察ができます。本装置の特徴として、検出される信号処理により、2次電子像、反射電子像、組成像、凹凸像、立体像の観察が可能です。また、高真空モードと低真空モードでの操作・観察が可能であり、低真空モードでは多孔質物質や含水物質、非導電性試料の無蒸着観察にも対応できます。 さらに、付帯するエネルギー分散型および波長分散型X線分析装置を用いて、微量元素の分析や多元素同時分析、元素カラーマッピングなど多様な分析測定が可能です。</p>	

